

Model

AX-365E

超高速、高精度120Hz/1kHz数字
高电容MLCC对应检测计

追加2pF档位以提升微小电容测定时精确度、稳定度
藉由定电压测定方式适用于高电容值的多层陶瓷电容之测包机检查制程



- 可切换串联等价回路、并联等价回路
- 可定电压信号测定(一部份文件位不对应)
- 可测定 $\tan \delta$ (不对应2pF RANGE)
- 施加间歇状测定电流[120 μ F/1.2mF RANGE], 以减少接触探针的磨损
- 各档位可选择三端点/五端点接触检知(CONTACT CHECK)
- 从微小容量到大容量广泛范围测定文件位[2pF~1.2mF RANGE]
- 具3位半显示(1999)及LO/GO/HI, 接触错物(CONTACT ERROR)信号输出
- 超高速测定:测定时间代表值 [1.2msec.:FAST MODE]
- 搭载RS-232C

Specifications

测定范围及准确度(周围温度23°C \pm 5°C)※D \leq 0.1 并联等价回路

测定档位	测定范围	最小分辨率	测定准确度	测定电压	
2pF	0.000pF~1.999pF	0.001pF	$\pm 1.0\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以内	1kHz, 5V $\pm 5\%$ [rms]	
20pF	0.00pF~19.99pF	0.01pF	$\pm 0.25\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以内		
200pF	0.0pF~199.9pF	0.1pF	$\pm 0.2\%$ of rdg $\pm 2\text{digit} \times \alpha$ 以内	1kHz, 1V $\pm 5\%$ [rms]	/
2nF	0.000nF~1.999nF	0.001nF	$\pm 0.2\%$ of rdg $\pm 2\text{digit}$ 以内		
20nF	0.00nF~19.99nF	0.01nF			
200nF	0.0nF~199.9nF	0.1nF			
2 μ F	0.000 μ F~1.999 μ F	0.001 μ F	$\pm 0.3\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以内	120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ [rms]	
20 μ F	0.00 μ F~19.99 μ F	0.01 μ F	$\pm 1.0\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以内	1kHz, 1V $\pm 5\%$ ~ -40% [rms]	/
120 μ F	0.0 μ F~120.0 μ F	0.1 μ F	$\pm 0.5\%$ of rdg $\pm 3\text{digit} \times \alpha$ 以内		
200 μ F	0.0 μ F~199.9 μ F	0.1 μ F	$\pm 1.5\%$ of rdg $\pm 5\text{digit} \times \alpha$ 以内		120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ [rms]
1.2mF	0.000mF~1.200mF	0.001mF			120Hz, 0.5V $\pm 5\%$ ~ -50% [rms]

※0.1<D<1时, 上述准确度加算25D/100(%)

※ α :FAST时为2(2.00pF 1.0V时 $\alpha=10$), SLOW时为1(2.00pF 1.0V时 $\alpha=5$)

测定方式	五端点测定方式[各档位可选择], 并联等价回路及串联回路换算显示
测定频率	120Hz/1kHz $\pm 0.1\%$ 、正弦波形
信号源输出阻抗	约1.5 Ω
寄生电容补偿范围	约30pF
全核度及零点温度系数	$\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 以内
测定时间	Free Running周期:FAST:约1~5次/秒 SLOW:FAST \times N(N:平均值设定次数) 自外部启动到INDEX信号的时间:FAST:1.2 sec(代表值)
比较器设定范围	Capacitance: HI/LO皆为1999[120 μ F, 1.2mF档位HI/LO皆为1199] $\tan \delta$: 99.9%
使用周围环境	温度: +5°C~+40°C、湿度: 85%以下
电源需求	AC85V~265V切换、50/60Hz、约50VA
外观尺寸	约333(W) \times 99(H) \times 300(D)mm (不包含橡胶垫等凸出物。)
重量	约4.0Kg

Option